

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СИЛЫ ПАТЕНТА: АНАЛИЗ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ

Кособрюхова Л.В. (ИТМО)

Научный руководитель – к.э.н., доцент ЦРИИС Николаев А.С. (ИТМО)

Введение. В структуре стоимости компаний патенты рассматриваются как индикатор технологической и экономической конкурентоспособности. Научные исследования, посвященные изучению силы патента, содержат различные подходы к измерению силы патентов компании. Исследователи также указывают на положительное влияние качества патентов на прибыльность технологически ориентированных предприятий [1]. Сила патента измеряется исследователями через различные группы показателей: количество цитирований, размер патентного семейства, правовые события. Отсутствие единой системы выбора и интерпретации показателей приводит к фрагментарности оценок и затрудняет сопоставление результатов оценки.

Основная часть. Исследование построено на обзоре и структуризации научных публикаций по методам оценки силы, качества патентов. Вектор исследований в этой области направлен на систематизацию литературы, эволюции количественных и качественных методов оценки патентов [2]. Оценка силы патента строится на анализе показателей и их групп.

По типу данных и логике оценки в ряде работ выделяют рыночные, доходные и индикаторные методы [2; 3]. Рыночные методы ориентированы на оценку фактической коммерческой стоимости, индикаторные модели опираются на параметры патентной документации и используются при анализе больших выборок. Доходные методы предполагают оценку ожидаемых денежных потоков, связанных с использованием патента, и, как правило, требуют построения прогнозных моделей [2]. Их применение связано с зависимостью от неточных допущений относительно будущей коммерциализации. Это ограничивает универсальность подобных подходов.

Наиболее распространёнными в научных исследованиях являются индикаторные методы, основанные на анализе характеристик патентной документации. В рамках данного направления сила или ценность патента рассматривается как многомерная категория, формируемая совокупностью правовых, технологических и научно-конкурентных характеристик [3]. При этом различные авторы используют неодинаковый набор показателей, что обусловлено как целями анализа, так и доступностью данных.

Систематизация публикаций позволила выделить несколько групп индикаторов, применяемых для оценки силы патента. К правовым характеристикам относят размер патентного семейства и параметры формулы изобретения, отражающие широту правовой охраны. Технологическое измерение, как правило, связывается с показателями цитируемости и скоростью первого цитирования, которые интерпретируются как индикаторы влияния изобретения на последующее развитие технологий. Конкурентные и научные аспекты оцениваются через количество прямых цитирований, число ссылок на патенты и непатентные источники, характеристики команды разработчиков.

Выводы. Использование одного показателя не позволяет получить устойчивую оценку силы патента, поскольку каждый индикатор отражает лишь отдельный аспект его значимости. Существующие методики оценки силы патента характеризуются разнообразием используемых индикаторов. Общепринятого индикатора силы патента не существует, что подтверждает эффективность портфельного метода, основанного на оценке совокупности показателей. Наибольшую информативность демонстрируют размер патентного семейства, показатели цитируемости. Формирование комплексной

оценки целесообразно строить на многомерной системе индикаторов, адаптируемой под цели анализа.

Список использованных источников:

1. Hanjun Chen, Long Qian, Haohao Gu, Qianqian Chen, Ke Zheng, Yong Zhang, Sha Dong Patent quality, R&D investment, and the profitability of technology-based firms // Finance Research Letters. - 2025. - №76;
2. Nil Girgin Kalip, Yaman Ömer Erzurumlu, Nur Asena Gün Qualitative and quantitative patent valuation methods: A systematic literature review // World Patent Information. - 2022. - №69;
3. Zewen Hu, Xiji Zhou, Angela Lin Evaluation and identification of potential high-value patents in the field of integrated circuits using a multidimensional patent indicators pre-screening strategy and machine learning approaches // Journal of Informetrics. - 2023. - № 17, Issue 2.